

トランジスタのDC特性試験

概要

バイポーラ、FETなどトランジスタのDC特性 ($V_{GS}-I_D$) を測定します。

GS820のチャンネル1よりゲートソース間電圧 V_{GS} を印加、チャンネル2よりドレイン-ソース間電圧 V_{DS} を印加し、ドレイン電流 I_D を測定します。

アプリケーションのポイント

1台のユニットに搭載された2チャンネルのソースメジャーを用いて、ゲート・ソース間に電圧を印加するとともに、ドレイン電流を測定します。

測定結果ワークシートをGS820本体より取得しグラフ化すれば、DC特性曲線が簡単に得られます。

特長

- 2チャンネル同期の電圧印加と電流測定
- 200nAレンジ、1pA分解能の微小電流測定
- 電圧/電流スイープによるカーブトレース機能
- 測定結果データのCSV出力
- 内蔵USBメモリへの簡単アクセス
- 専用ソフトウェア不要

